



Contribution ID: 13

Type: **oral**

Quantitative and chemical characterization capabilities for atomic layer depositions using synchrotron-based reference-free X-ray spectrometry

Tuesday, 14 June 2016 11:45 (20 minutes)

Primary author: Mr HOENICKE, Philipp (Physikalisch-Technische Bundesanstalt)

Co-authors: Dr POLLAKOWSKI, Beatrix (Physikalisch-Technische Bundesanstalt); Dr BECKHOFF, Burkhard (Physikalisch-Technische Bundesanstalt); Dr MUELLER, Matthias (Physikalisch-Technische Bundesanstalt)

Presenter: Mr HOENICKE, Philipp (Physikalisch-Technische Bundesanstalt)

Session Classification: Talks 3